

2018年度 第11回 LSI テストセミナー

日時：2019年3月14日（木）9時～21時30分

場所：電気ビル共創館カンファレンス E 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82

TEL: 0120-222-084

9時～9時25分 会場設営・受付

9時25分～9時30分 オープニング 温 暁青（九州工業大）

9時30分～10時

動作解析に用いる複数のウェアラブルセンサの同期に関する研究

○大庭涼、古賀千裕、Stefan Holst、宮瀬紘平、得居雅人（九州工業大）

10時～10時30分

RISC-V プロセッサのテスト容易化機能的時間展開モデル生成のためのテスト容易化設計」

○石山悠太，細川利典，山崎紘史（日本大学）

休憩（10時30分～10時45分）

10時45分～11時15分

多重故障を対象にした効率的な ATPG アルゴリズム

○松永 裕介（九大）

11時15分～11時45分

FPGA の信頼性向上について

○森山康平，大竹哲史

休憩（11時45分～13時15分）

13時15分～13時45分

組合わせ回路ループを用いた論理暗号化の耐性評価

○田中寛生，吉村正義

13時45分～14時15分

Scan Chain Grouping for Mitigating IR-Drop-Induced Test Data Corruption

○Y. Zhang, S. Holst, X. Wen, K. Miyase, S. Kajihara (九州工業大学), and J. Qian(AMD)

14時15分～14時45分

MAX-SAT を用いた低消費電力指向 X 割当て法

○三澤健一郎，細川利典，山崎紘史，新井雅之（日本大学），吉村正義（京都産業大）

休憩 (14 時 45 分～15 時)

15 時～15 時 30 分

論理暗号化手法のパラメータ変更に対する評価

○南 周作, 松永 裕介 (九大)

15 時 30 分～16 時

拡張シフトレジスタと暗号鍵を用いたスキャンチェーンの難読化手法

○大土井駿介, 吉村正義

休憩 (16 時～16 時 15 分)

16 時 15 分～16 時 45 分

データパス部の遷移故障検出率向上のためのコントローラ拡大法

○竹内勇希, 細川利典, 山崎紘史 (日本大学), 吉村正義 (京都産業大)

16 時 45 分～17 時 15 分

Framework for Quantifying and Managing Accuracy in Stochastic Circuit Design

○Florian Neugebauer and Ilia Polian (University of Stuttgart), and John P. Hayes (University of Michigan).

17 時 15 分～17 時 30 分 諸連絡 宮瀬 紘平 (九工大)

休憩 (17 時 30 分～18 時)

18 時～21 時 30 分

LSI テストに関する討論